## INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## DETERMINAÇÃO DE HETEROGENEIDADES EM UO2 - ThO2 POR MEIO DE MICROSSONDA ELETRÔNICA

## **REJANE APARECIDA NOGUEIRA**

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de "Mestre na Área de Concentração em restores Nucleares de Potência e Tecnologia do Combustível Nuclear".

Orientador: Dr. Clauer Trench de Freitas

).542.34

## INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

# DETERMINAÇÃO DE HETEROGÊNEIDADES EM UO $_2$ - ThO $_2'$ POR MEIO DE MICROSSONDA ELETRÔNICA

Rejane Aparecida Nogueira

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do Grau de "Mestre na Área de Concentração em Reatores Nucleares de Potência e Tecnologia do Combustível Nuclear".

> 1P 5 1/ (LIVRO) Nº 17130) TO 1 VIOI

Orientador: Dr. Clauer Trench de Freitas

SÃO PAULO 1983

Nos neus país,

.

.

.

.

.

2

-

#### AGRADECIMENTOS

Ao Dr. Claver Trench de Freitas pela orientação.

Ao Dr. C.T. Walker do Euratom-Karlsruhe, pela possibilidade de utilização da microssonda eletrônica, bem como aos técnicos W. Ziehl e R. Windbiel pela ajuda no decorrer do trabalho exper<u>i</u> mental.

Ao Dr. Reginaldo Muccillo pelo auxílio e apoio sempre opo<u>r</u> tuno.

Aos amigos Anacleto M. de Figueiredo , Ana Lúcia E. Godoy e Diva Glasser Leme pelo estímulo o principalmente pela paciência demonstrada.

A todos os colegas do Departamento de Metalurgia Nuclear que contribuíram para a realização deste trabalho.

Ao Dr. Ivan de Aquino Viana pelo apoio oferecido.

Ao Dr. Durvaldo Gonçalves, Superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-CNEN/SP pelas facilidades ofer<u>e</u> cidas, sem as quais este trabalho não podería ter sído realizado.

## DETERMINAÇÃO DE HETEROGENEIDADES EM U0<sub>2</sub> - Th0<sub>2</sub> POR MEIO DE MICROSSONDA ELETRÔNICA

REJANE A. NOGUEIRA

#### RESUMO

Estabeleceu-se um procedimento para a determinação de hetero geneidades em combustíveis corâmicos obtidos por mistura física de  $UO_2$  e ThO<sub>2</sub>, utilizando-se diferentes técnicas de medidas possíveis por meio de uma microssonda eletrônica. Consideraram-se amostras com diferentes porcentagens relativas dos óxidos preparadas a pa<u>r</u> tir de pós de urânia e tória. Para as amostras com menor concentr<u>a</u> ção de heterogeneidades o  $UO_2$  foi obtido pela redução em atmosfera de hidrogênio, a 800 °C do  $U_3O_8$  originário da calcinação de DUA a 660 °C; ThO<sub>2</sub> foi obtido pela calcinação a 660 °C de oxalato de t<u>ó</u> rio.

Os principais resultados alcançados a partir da análise em m<u>i</u> , crossonda eletrônica permitiram:

- <u>por meio das imagons de raios-X</u>, a determinação da distribu<u>i</u> ção relativa dos óxidos de urânio e tório na matriz e averificação da frequência de ocorrência de heterogeneidades ricas em urânia ou tória, por meio da qual foram derivados os diâmetros médios e máx<u>i</u> mos das heterogeneidades ricas em UO<sub>2</sub> considerando-se os histogramas correspondentes.

- por meio da análise em uma linha por varredura mecánica, de rivar a distribuição dos elementos, com a consequente avaliação semi-quantitativa de suas concentrações, bem como as dimensões das heterogeneidades presentes, através da medida da largura ã meia al tura dos picos correspondentes.

- por meio da análise em um ponto, o cálculo da composição el<u>e</u> mentar quantitativa tanto da matriz quanto das heterogeneidades.

A utilização da microssonda eletrônica mostrou ser a altern<u>a</u> tiva válida para a determinação de heterogeneidades em combustíveis cerâmicos urânia-tória, particularmente tendo em vista as dificu<u>l</u> dades tanto da utilização de métodos óticos usuais quanto da técn<u>i</u> ca de autoradiografia α.

# DETERMINATION OF HETEROGENEITIES IN U0<sub>2</sub> - Th0<sub>2</sub> USING ELECTRON MICROPROBE ANALYSIS

#### REJANE A. NOGUEIRA

#### ABSTRACT

An experimental procedure for the determination of heterogeneities in physically mixed thoria-urania nuclear fuels has been established with the aid of microprobe analysis. Specimens with different  $UO_2$ : ThO<sub>2</sub> ratios have been studied. Specimens with lower levels of heterogeneity contained  $UO_2$  obtained by reduction of  $U_3O_8$  with  $H_2$  at 800 °C; the  $U_3O_8$  having been prepared by calcination of ADU at 660 °C. The ThO<sub>2</sub> used was obtained by calcination of thorium oxalate at 660 °C.

The main electron microprobe analysis results allowed for:

1. by means of X-ray scanning images, the determination of the relative distribution of uranium oxide and thorium oxide as well as the detection frequency of urania-or thoria-rich regions. These results yielded information for calculating the average and maximum diameters of the U0<sub>2</sub>-rich heterogeneities with the aid of the corresponding histograms;

2. by means of linear scan analysis, the determination of the distribution of the elements and a semi-quantitative evaluation of element concentrations and the dimensions of the heterogeneities from the half-width of the corresponding peaks;

3. by means of static probe analysis, the determination of the elemental composition of the matrix as well as the heterogeneities.

It has also been shown that the electron microprobe analysis is an useful and suitable technique for the study of heterogeneities in urania-thoria ceramic fuels, mainly if the inherent difficulties in the use of optical and alpha-radiographic techniques are taken into account.

## INDICE

## PÁGINA

1.	INTRODUÇÃO	01
	J.1. A Utilização do Tório em Reatores de Potência	01
	1.2. U0 <sub>2</sub> - Th0 <sub>2</sub> como Combustível Nuclear	02
	1.3. Aspectos de Segurança Operacional de Combustíveis Relacionados a Heterogeneidades em UO <sub>2</sub> - ThO <sub>2</sub>	03
	1.3.1. Introdução 1.3.2. Distribuição dos Óxidos nas Pastilhas	03 03
	1.4. Objetivos do Trabalho	04
2.	FUNDAMENTOS TEÓRICOS	05
	2.1. A Natureza da Microanálise por Raios-X	05
	2.2. Produção de Raios-X	06
	2.2.]. Ionização dos Átomos	06
	2.2.2. Caracterízação dos Elementos	07
	2.2.3. Ionização por Eletrons 2.2.4. Espectro de Raios-X	08 09
	2.3. Sistemas de Detecção de Raios-X	09
	2.3.1. Espectrometria Mediante - Medidas de Compr <u>i</u>	
	mentos de Onda de Linhas Características	09
	2.3.1.1. Cristal de Difração	10
	2.3.1.2. Detector	13
	2.3.2. Espectrometria Mediante Medidas de Energias	
	Associadas a Linhas Características	14
	2.4. Microanálise Quantitativa de Raios-X	15
	2.4.1. Correções Quantitativas	15
	2.4.1.1. Efeito do Número Atômico	16
	2.4.1.2. Efeito da Absorção	18
	2.4.1.3. Efeito da Fluorescência	19
	2.4.1.4. Constante K	20
	(NACTORNO : LETSON CALL DAR LA CONTRACTORNO )	

.

## PÁCINA

	2.5.	Técnicas de Medidas por meio de Microssonda Eletr <u>ô</u>	
		nica	21
		2.5.1. Análise de Superfície Através das Imagens	
		de Raios-X	21
		2.5.2. Análise em Uma Linha por Varredura Mecânica	Z 2
		2.5.3. Análisc em Um Ponto	2 Z
3.	PARTI	E EXPERIMENTAL	24
	3.1.	Preparação dos Pós	24
		3.1.1. Preparação do U0 <sub>2</sub>	25
		3.1.2. Preparação do ThO <sub>2</sub>	25
	3.2.	Preparação dos Corpos de Prova	25
		3.2.1. Compactação e Caracterização dos Corpos de	
		Prova	25
		3.2.2. Sinterização e Caracterização das Pastilhas	
		Sinterizadas	26
	3.3.	Preparação Metalográfica das Amostras	28
1	3.4.	Recobrimento	Z 8
4.	RESU	LTADOS E DISCUSSÃO	29
	4.1.	Resultados Obtidos por meio das Imagens de Raios-X	30
	4.2.	Resultados Obtidos por meio da Análise em. Uma Li	
		nha Correspondente a Varredura Mecânica	48
	4.3.	Resultados Obtidos por meio da Análise em um Ponto	53

.

#### 1. INTRODUÇÃO

## 1.1. A UTILIZAÇÃO DE TÓRIO EM REATORES DE POTÊNCIA

O  $U^{235}$ , único isótopo físsil encontrado em quantidades signi ficativas no urânio natural, foi a base para o desenvolvimento co mercial da energia nuclear. Outros isótopos físseis, como Pu<sup>239</sup> e  $U^{233}$ , podem ser produzidos em quantidades aproveitáveis mediante a irradiação, em reatores, de  $U^{238}$  e Th<sup>232</sup>, respectivamente. Nos ú<u>l</u> timos anos tem se tornado claro que a exploração do urânio apenas para aproveitamento do  $U^{235}$  é, quando muito, uma solução temporária para o problema de suprimento de energia nuclear. Devido ã demanda crescente, o custo para a extração do  $U^{235}$  tornará proibitiva, alon go prazo, a utilização desse isótopo em vários tipos de reatores, presentemente comerciais<sup>(15)</sup>.

O emprego de tório como material fértil apresenta como pri<u>n</u> cipal vantagem sua alta taxa de conversão em reatores térmicos. A taxa de produção de néutrons térmicos para o U<sup>233</sup> produzido pela captura de 1 nêutron em Th<sup>232</sup> é 2,27, comparada com 2,1 para U<sup>235</sup> e 2,0 parao Pu<sup>239</sup>. Assim, o sistema tório-U<sup>233</sup> apresenta maiores t<u>a</u> xas de conversão fazendo com que o combustivel tenha uma vida mais longa.

A possibilidade da produção contínua de mais  $U^{233}$  do que  $\tilde{e}$  consumido, depende principalmente do projeto do caroço do reator; tal superregeneração é possível tanto em reatores térmicos como r<u>a</u>pidos <sup>(38, 39)</sup>.

As propriedades neutrônicas favoráveis do U<sup>233</sup> não ajudam so mente na redução do custo do ciclo do combustível, mas também con duzem a uma utilização mais eficiente das reservas de urânio<sup>(11)</sup>. A importância do desenvolvimento do tório como material fértil pa ra a expansão dos programas de energia nuclear é evidente, observan do-se que vários países tem realizado trabalhos nessa área<sup>(11)</sup>.

Os reatores de alta temperatura refrigerados a gás (HTCR) tem surgido como um dos principais meios para aplicação do tório na pro dução de energia. Existe também a possibilidade de utilizar tório em reatores de água pesada ou refrigerados à líquidos orgânicos ou ainda a sais fundidos, mas os trabalhos neste campo ainda estão em estágio de desenvolvimento.

O Brasil, devido ãs suas extensas reservas de minérios de tó

rio, possui um particular interesse na utilização deste elemento fértil em seu programa nuclear. Desde a década de 60, o ciclo do tório está sendo estudado, para verificar se uma razoável econo mia de minério de urânio pode ser alcançada, ou se se pode comp<u>e</u> tir, em geral, com o ciclo de plutônio<sup>(29)</sup>. Um desses estudos s<u>e</u> bre a utilização do tório nos reatores PWR, que estão sendo con<u>s</u> truídos em Angra dos Reis, demonstra a possibilidade de uma red<u>u</u> ção de até 30% no consumo de urânio<sup>(19)</sup>.

## 1.2. U0, - Th0, COMO COMBUSTIVEL NUCLEAR

Sob o ponto de vista econômico, a atratividade dos reato res de potência depende substancialmente do desempenho e da vida do combustível utilizado. Sob estes aspectos, os combustíveis c<u>e</u> râmicos têm apresentado melhores resultados do que os metálicos, sendo utilizados na maioria dos reatores atualmente em operação e en construção. No desenvolvimiêto de combustíveis contendo tório, pode-se mencionar entre outras, algumas experiências realizadas em quatro reatores nos Estados Unidos (Indian Point,Elk River, Peach Botton e Borax-IV) e em dois na Europa (AVR e Dragon): também tem sido enfatizado o uso desse elemento fértil em microesferas de óxido de tório contendo U<sup>233</sup> recobertas com carbono pirolítico, em reatores tipo HTGR<sup>(14, 18, 38)</sup>.

O óxido de tório apresenta-se com estrutura cúbica tipo fluo rita, em qualquer temperatura, até seu ponto de fusão. Nole a so lubilidade de oxigênio não é mensurável; é estável em meios oxidantes a altas temperaturas, sendo também isomorfo e completamen te miscível com UO,. O óxido de tório tem sido extensivamente les tudado como combustível nuclear, em geral com pequenas adições de õxido de urânio. Os combustíveis UO $_2$  - ThO $_2$  tem alto ponto de fu são, excelente estabilidade química e boa compatibilidade com а maioria dos metais. Foram observadas algumas diferenças na estru tura do combustível irradiado, em relação ao U $0_7$  puro, pri<u>n</u> cipalmente devido ao maior ponto de fusão e menor pressão de vapor do ThO<sub>2</sub>. A condutividade térmica da mistura UO<sub>2</sub> -ThO<sub>2</sub> apresenta-se essencialmente da mesma maneira que a do U0, puro, decrescendo em valor com o sumento da concentra ção de UO<sub>2</sub>. Tem boa rotenção dos gases provenientes fissão e apreciável estabilidade estrutural<sup>(24, 28, 33)</sup>. da

.2.

1.3. ASPECTOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE COMBUSTÍVEIS RELACIONA DOS A HETEROGENEIDADE EM U0<sub>2</sub>-Th0<sub>2</sub>

#### 1.3.1. Introdução

Quando são usados combustíveis fabricados com óxidos mistos, pelo método de mistura física, um importante problema com implicações de segurança pode surgir, devido à possível presença de heterogeneidades substanciais nas pastilhas sinterizadas.

Modificações locais de distribuição de potência po dem ocorrer devido à presença de partículas grandes ou agregados. Além disso, em condições de regime transitório na operação de rea tores, a influência desses agregados físseis próximos à superfície da pastilha é importante no que concerne ao aumento de riscos de falha do encamisante (26, 27).

Embora esse assunto esteja sendo estudado intensivamente para o caso de combustíveis constituídos pela mistura  $PuO_2 - UO_2$ , a literatura disponível não indica o mesmo sobre o efe<u>i</u> to de heteroneidades no desempenho de combustíveis obtidos por meio da mistura de  $UO_2$ -ThO<sub>2</sub>.

## 1.3.2 Distribuição dos Óxidos nas Pastilhas

Os combustíveis formados por óxidos mistos  $UO_2$ -Th $O_2$ podem constituir uma completa e contínua série de soluções sóli das, devido à interdifusão dos cátions através da mistura, dura<u>n</u> te a sinterização, com consequente elevação do grau de homogenei zação. Dependendo das condições de fabricação, pode-se, todavia, obter maior ou menor fração de solução sólida. O conhecimento des ta fração é decisivo para uma avaliação do desempenho do material.

Em princípio é possível determinar a fração de solu ção sólida por diversas técnicas. Entretanto, este objetivo será alcançado mais facilmente por uma análise da amostra por meio de difração de raios-X ou microssonda eletrônica. A técnica de anál<u>i</u> se por microssonda requer um tempo mais longo para o estudo de partes significativas da amostra. Por outro lado, a análise por difração, embora mais rápida, baseia-se na Lei de Vegard e pode ser aplicada estritamente a óxidos estequiométricos<sup>(37)</sup>.

É questionável ainda que o difratometria de raios-X possa de maneira expedita determinar a percentagem total de solução sólida em materiais sinterizados apresentando consider<u>á</u> veis concentrações de regiões diminutas (- 1 - 15µm), constituídas por soluções sólidas em uma matriz heterogênea de óxidos mistos<sup>(7)</sup>. Se os óxidos de urânio o tório não forem completa-

mente dissolvidos na matriz, razões de segurança de operação do reator requerem que o tamanho dessas regiões ricas ou empobrec<u>i</u> das em óxidos de urânio e tório sejam rigorosamente determinadas na etapa do controle do produto final. Nessa situação, particular interesse é dispensado para a técnica usada na detecção das po<u>s</u> síveis heterogeneidades existentes em pastilhas combustíveis e para os procedimentos adotados no controle de qualidade <sup>(26,27,30,37)</sup>

Duas técnicas de análise das heterogeneidades tem sido mencionadas em literatura; envolvendo respectivamente micro<u>s</u> sonda eletrônica ou autoradiografia alfa<sup>(8, 31, 37)</sup>.

#### 1.4 DBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se determ<u>i</u> nar um método para a análise de hetrogeneidades presentes em com bustíveis nucleares constituídos por misturas físicas de oxidos. Assim, foram realizadas experiências no sentido de obter inform<u>a</u> ções sobre tamanhos médios e máximos dessas heterogeneidades, fr<u>e</u> quência da ocorrência e distribuição, utilizando-se para essas d<u>e</u> terminações, diferentes técnicas de análises, possíveis por meio de uma microssonda eletrônica.

Pelas razões expostas anteriormente na Introdução, devido a importância do óxido de tório para as condições brasileiras de desenvolvimento nuclear U0<sub>2</sub>-Th0<sub>2</sub> constituíu o material de referê<u>n</u> cia para este trabalho.

Julgou-se que os resultados obtidos poderiam ser em parte extensíveis a outros sistemas de óxidos mistos, de interesse l<u>o</u> cal no futuro.

Procurou-se também verificar a cocrência dos resultados ob tidos mediante a aplicação de ceramografia ótica.

#### FUNDAMENTOS TEÓRICOS

#### 2.1 A NATUREZA DA MICROANÁLISE FOR RAIOS-X

Quando um feixe de elétrons incide em uma amostra sólida di versos tipos de interações podem ocorrer, sendo as mais importantes ilustradas na Figura 2.1. Os elétrons podem ser espalhados por cho que com a superfície da amostra, com pequena ou sem perda de ener gia ou podem interagir com os átomos de superfície produzindo elétrons secundários(baixa energia). Alguns elétrons podem ser absor vidos pela amostra, havendo transformação de energia em calor ou. algumas vezes, em luz. Elétrons transmitidos podem não ter mudança na direção ou serem espalhados em diferentes ângulos. O espalhamen to de elétrons pode ser elástico (não há perda de energia) ou іле lástico (alguma perda de energia). Se for transmitida energia do feixe para a amostra, pode haver produção de elétrons Auger ouRaios -X. Cada um desses eventos fornece informações sobre a amostra. En tretanto será mais utilizado neste trabalho a geração de 👘 raios-X por clétrons de alta encrgia.

A microanálise por raios-X faz uso do fato de que átomos, na interação com elétrons provenientes de uma fonte externa, originam raios-X característicos. Consequentemente, os raios-X podem serus<u>a</u> dos para identificar e quantificar os elementos presentes<sup>(4)</sup>.



Figura 2.1 - Processos de interação possíveis durante a incidên cia de um feixe de elétrons em uma amostra sólida.

#### 2.2 PRODUÇÃO DE RAIOS-X

## 2.2.1 Ionização de Atomos

Um átomo está, no estado excitado se um de seus elē trons passa para um orbital mais energético; se o elétron for dis sociado do átomo então esse está ionizado. Para que e átomo se les tabilize, um elétron de um orbital de energia mais alta move-se imediatamente para outro nível energético e o excesso de energia dessa transição é emitido como um fóton de raio-X. Esta energia de raios-X é a diferença da energia potencial entre as duas camadas. Dessa forma, se o clétron arrancado provém da camada K.Figura 2.2, e seu lugar é preenchido por um elétron da camada L, o foton de raio-X terá uma energia  $E_{L} = E_{K}$ , onde  $E_{L} \in E_{K}$  são as respectivas energias orbital-elétron. O vazio será criado na camada L e loutra transição ocorre quase simultaneamente, por exemplo da camada M pa ra a camada L, novamente ⊂om a emissão de um fóton de raio-X.Em um átomo com número atômico alto, um único evento de ionização pode causar um elevado número de transições orbitais e, portanto, um gran de número de picos de transição correspondentes a um espectrode emissões de rajos-X.



Figura 2.2 - Modelo simplificado da produção de raios-X

#### 2.2.2 Caracterização dos Elementos

Algumas das transições de elétrons que podem ocorrer om um átomo, quando a camada interior K é ionicada, são ilustradas na Figura 2.5. Elementos pesados como o urânio (I= 92), apresentam um grande número de emissões espectrais. O sódio (I= 11),por outro lado, tem semente 11 elétrons orbitais e, portanto, poucas emissões de raios- $\lambda$ . Pelas lois da mecânica quântica, entretanto, nem todas as transições são permitidas. As emissões, ou linhas caracte rísticas de raios-X, variam também em intensidade, sendo em geral utilizadas as de maior intensidade para a caracterização do átomo. Na prática, as linhas mais intensas são aquelas provenientes da transição E<sub>L</sub> - E<sub>K</sub> (chamada linha K), seguida pela transição E<sub>M</sub> - E<sub>L</sub> (linha L), E<sub>N</sub> - E<sub>M</sub> (linha M), e assim por diante<sup>(4)</sup>.



Figura 2.3 - Algumas emissões de raios-X produzidas por transições de elétrons entre os o<u>r</u> bitais.

A relação existente entre a frequência de raios-X e o número atômico 2 é dada por:

```
v= 3/4 cR(2-1) onde c = velocidade da luz
R = constante de Rydberg
Z = número atômico
```

Esta equação foi primeiramente proposta por Mosoley em 1914 e, desde então, todos os elementos da tabela periódica tem sido caracterizados por intermédio desta relação, sendo seus espec tros de emissão de rajos-X tabelados. A frequência v da radiação de raios-X está relacionada ao quantum de energia E pela equação E= hv, onde h é a constante de Planck. A relação entre a energia E,em el<u>e</u> tron volts (eV), e o comprimento de onda  $\lambda$ , em  $\vec{A}$ , é dada por:

 $E = 12396 / \lambda$ 

2.2.3. Ionização por Elétrons

A microanálise por raios-X requer a geração dessa ra diação na amostra, mediante a ionização dos átomos nelas contidos. Em microscópios eletrônicos, essa ionização é causada por um feixe de elétrons que precisa ter energia suficiente para dissociar um elétron de uma camada interna do átomo. Essa energia é conhecida co mo potencial crítico de excitação e tem um valor discreto para ca da nível de elétron orbital. Os elétrons & requerem maior energia de excitação que os elétrons L e os níveis de energia diferem en tre elementos, aumentando geralmente de valor com o número atômico. A Figura 2.4 mostra as energias de raios-X emitidas por elementos con números atômicos crescentes, indicando as linhas K, L e M e a faixa de energias mais utilizadas para a detecção dos raios-X.



Figura 2.4 - Energia dos raios-X das linhas K,L e M em função do número atômico.

2.2.4. Espectro de Raios-X

As possíveis transições que podem ocorrer entre elé trons orbitais contidos em um átomo, já foram mostradas na Figura 2.3. Elementos leves produzem um menor número de linhas que asmos tradas na Figura 2.3., sendo que átomos pesados apresentam um 👘 es pectro mais complexe. Com elementos pesados nem sempre é possível excitar as linhas K do átomo. Por exemplo, a linha K<sub>x</sub> do - uránio possui um potencial de excitação de 115.6 keV e, por conseguinte. um feixe primário de elétrons de 50 kV não é suficiente para cau sar ionização. Consequentemente, em microssondas e microscópios eletrônicos comerciais, nos quais o potencial de aceleração de elé trons é geralmente menor que 60 kV, a linha L $_{\rm a}$ , que tem uma ener gia de 13,6 keV, é utilizada com mais frequência para o uranio . Uma outra consideração é em relação à capacidade do sistema de de tecção de raios-X para determinar eficientemente uma dada energia de raics-X. Usando urânio novamente como exemplo, é mais fácil se detectar a intensidade da linha  $M_{\mu}$ , que ocorre a 3,17 keV do aue a linha  $L_{\alpha}$ , embora a intensidade da linha  $L_{\alpha}$  seja maior<sup>(4)</sup>.

## , 2.3 SISTEMAS DE DEFECÇÃO DOS RAIOS-X

2.3.1. Espectrometria Mediante Medidas de Comprimentos de Onda de Linhas Características

O princípio da espectrometria mediante medida de com primento de onda de linhas características é mostrado na Figura 2.5. Sob bombardeio de elétrons, vários elementos da amostra emi tem raios-X em uma faixa  $L\lambda$  de comprimento de onda. Estes raios-X deixam a amostra segundo o ângulo sólido mostrado na Figura 2.5 e atingem o cristal de difração que, por ter um tamanho finito, per mite que somente um cone limitade de raios-X atinja o detector. A fração do feixe de raios-X refletida no cristal é definida pela Lei de Bragg, pela qual somente um feixe de fótons com um compri mento de onda particular ( $\lambda$ ) reflete-se fortemente segundo um cer to ângulo. A Lei de Bragg estabelece que:

#### $n\lambda = 2d \text{ sen} \Theta$

onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda dos raios-X que são difratados, d é o espaçamento da rede cristalina e Θ é o ângulo de incidência (e de reflexão) dos rajos-X que atingem ocris tal, conforme Figura 2.5.



Figura 2.5 - Coleta dos raios-X em espectrometro com cristal mediante modidas de comprimento de onda.

Então, para um cristal com espaçamento de rede conh<u>e</u> cido d, e para um ângulo de incidência definido 0,0 comprimento de onda dos raios-X difratados que alcançam o detector pode ser calcu lado. Na prática, o cristal é girado através de uma faixa angular, até que um máximo de intensidade seja observado no detector; nessa posição, a Lei de Bragg é satisfeita e o comprimento de onda dos raios-X detectados pode ser calculado.

2.3.1.1. Cristal de Difração

O cristal é encurvado ou esmerilhado para um raio R, de maneira a conduzir o feixe divergente de raios-X emi tidos pela amostra para um foco localizado em uma circunferência de raio 1/2R; denominando-se círculo de Rowland o círculo corresponde<u>n</u> te<sup>(4)</sup>. Nos espectrômetros de relativamente grande poder de resolução, o cristal e o detector são livres para se moverem sobre aquela circunferência e a amostra se encontra num ponto fixo da mesma.

Existem espectrômetros com cristal com dois tipos de geometria: uma chamada de geometria Johann, Figura 2.6.a, e outra de geometria Johansson, Figura 2.6.b. Na geometria Johansson os planos do cristal são encurvados de forma a terem o mesmo raio; a superfície côncava é então esmerilhada para ter o mesmo raio do

círculo de Rowland. A amostra, cristal e detector estão sobre o cír culo e o ângulo de Bragg correto é mantido sobre todos os pontos da superfície do cristal, no plano do círculo de Rowland. Se a super fície do cristal não for encurvada para o raio R do círculo, temse a Geometria Johann. Nesta, o ângulo de Bragg correto é mantido somente em up único ponto do cristal.

O uso de uma ou de outra Geometria depende do cristal escolhido para a análise.



AT BEOMETRIA DE JOHANN



(E) Secmetria de Johansson

Cada cristal abrange uma determinada faixa de comprimentos de onda; para aumentar esta faixa um espectrômetro de difração é muitas vezes equipado com vários cristais.Estes cris tais apresentam diferentes valores de espaçamento de rede d. detal modo que para uma mesma faixa de ângulos 5, o intervalo de compri mentos de onda é aumentado e um maior número de elementos é abran gido. Os tipos de cristais comunente utilitados em espectrômetros de difração são apresentados na Tabela 2.1.

TABELA 2.1 - Tipos de Cristais Comumente Usados em Espectrômetros de Difração.

						Fai>	- La Analīt	ti⊂a <sup>(t)</sup>	
Cristal	Formula	(hk1)	2d (Å)		λ (2	A)	K	L	M
LIF	LIF	2 <u>0</u> 0	4.026	710.84	-	3.30	Sc-Sr	Te-U	
Quarteo	Si0,	1011	6.686	2 1.39	-	5.48	S-Zn	Mo-Re	T1-9
PET( <sup>1</sup> )	C_H_201	002	8.74	11.82	-	7.16	Si-Fe	Sr-Ho	¦ ⊮່⊸ປ
Mica( <sup>2</sup> )	$K_{2}A_{1}Si_{2}O_{20}(F,OII)_{A}$	002	19.84	4.13	- 1	16.25	Ne-A	Co-Ag	La-Th
KAP(3)	$[C_{e}H_{z}O_{A}K]$	1011	26.632	5.54	- 3	21.81	F→P	Ma-Mo .	La-Hg
TAP(")		1011	25.75	5.36		21.10	Г-Р	Mtt - Mo	La-Hg
ОДРЪ( <sup>5</sup> )	(C <sub>18</sub> H <sub>35</sub> 0 <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Pb	-	100	22	- 4	82	з-о	C-V	-

Pentaeritritol (2) Muscovita

(3) Ftalato ácido de potássio

(") Ftalato ácido de tálio

(5) Octodecanato de chumbo (estearato)

(6) Calculado para ângulo de Bragg entre 12° e 55°.

Os cristais podem ser obtidos de minerais que ocorrem na natureza, como mica ou gipso ou podem ser preparados sinteticamente, como os cristais de estearato, que são constituídos por múltiplas camadas mono-moleculares daquele material e que são usados para a difração de rajos-X de comprimento de enda muito lon gos provenjentes de elementos leves. Para uma boa resolução e alta eficiência de difração das linhas de rajos-X, o cristal precisa ser de excelente qualidade sem defeitos ou falhas. O mecanismo que go verna a posição do cristal, em relação ã amostra e ao detector, pre cisa ser de alta precisão para que sealcance reprodutibilidade demedidas

## 2.3.1.2. Detector

Após estarem seletivamente difratados pelo cristal, os raios-X de um determinado comprimento de onda definido passam através de um colimador em direção ao detector. Os detectores comunente utilizados são os contadores proporcionais, Figura 2.7. Es tes consistem de um cilindro preenchido com gás, com um fio ao longo da direção axial. O fio é isolado do cilindro e está a um potencial positivo em relação ao corpo do detector, que está aterrado. Os rai os-X atingem o detector através de uma fina janela de plástico,que é tipicamente um filme de um polímero orgânico com 2 pm de espessora, sendo necessária para manter o gás do cilindro a uma pressão posit<u>i</u> va.

Os contadores proporcionais podem ser do ti po selado; Figura 2.7.a, ou à gás; Figura 2.7.b. Nos contadores sela dos são usadas janelas relativamente espessas, permeáveis a raios-X, para evitar a fuga de gás, que deve permanecer confinado no interior do detector. No tipo a gás, janelas ultra-finas são usadas e o gás que passa pelo cilindro deve ter vazão constante. Esse tipo é também usado quando raios-X muito fracos (comprimento de onda longo) são d<u>e</u> tectados, podendo uma janela mais espessa causar atenuação. O gás ut<u>i</u> lizado nos contadores proporcionais consiste de uma mistura de argô nio e metano ou argônio com dióxido de carbono.

Quando um foton de raio-X entra no contador e colide com uma molécula de gás, cede parte de sua energia ionizan do a molécula. Isto produz um par elétron-fon. O potencial positivo do fio atrai o elétron, que então ganha energia suficiente para ioni zar outras moléculas. O resultado final é uma avalanche de elétrons passando pelo fio para produzir um pulso elétrico com amplitude depeni dente da energia do foton do raio-X original. A intensidade inicial do feixe de raios-X, que está relacionada ao número atômico do elemento que está sendo analisado, é então associada a um número propor cional de pulsos elétricos.

.15.



- Figura 2.7 Esquema dos contadores proporcionais (a) contador proporcional selado (b) contador proporcional a gás
- 2.3.2. Espectrometria Madiante Medidas de Energias Associa das a Linhas Características

Uma alternativa para identificação dos raios-X emit<u>i</u> des pela amostra é a medida da energia dos mesmos por meio de dete<u>e</u> tores de estado sólido por exemplo (silício com camada de lítio difun dido) que apresentam bom poder de resolução. Esses detectores requ<u>e</u> rem o uso de nitrogênio líquido e são extremamente sensíveis à cont<u>a</u> minação de superfície, por isso devem estar fechados em recipientes com janelas de berílio, sob vácuo. Utilizados com um analisador de amplitude, multicanal, oferecem duas vantagens:

- numa so operação de contagem se mede todo o espectro;
- podem estar muito próximos ao ponto de impacto do feixe de elétrons, cobrindo dessa forma um amplo ân gulo sólido e aumentando assim a intensidade medi da, em relação aos espectrômetros descritos em 2.3.1.<sup>(6)</sup>.

Tem como inconvenientes:

- menor poder de resolução;

 - uma relação de intensidade de pico/intensidade de ruído de fundo muito mais baixa que nos espectrône tros descritos em 2.3.1.<sup>(6)</sup>.

## 2.4 MICROANÁLISE QUANTITATIVA POR RAIOS-X

A microanálise por raios-X é primordialmente um método muito rápido de se definir qualitativamente quais os elementos presentes na região da amostrá que está sendo analisada. Para determinar a concentração de cada elemento, há necessidade de se utilizar cálcu los matemáticos. A complexidade das medidas efetuadas irá variar de acordo com a informação requerida da amostra. A análise mais simples consiste em se estudar a distribuição relativa de um elemento ou ele mentos ao longo da amostra, sem se estimar as concentrações absolu tas. Se a concentração absoluta for requerida, então usualmente – é necessário o uso de padrões, que são amostras com concentrações <u>co</u> nhecidas dos elementos a serem analisados.

Para entendor o desenvolvimento de uma análise quantitativa simples,entretanto,é útil primeiro discutir os efeitos das interações elé tron-amostra, com referência à geração de raios-X <sup>(2,3,6,10,16,17,20,25)</sup>.

## 2.4.1. Correções Quantitativas - Método ZAF

Como foi visto anteriormente no îtem 2.1., para a pro dução de um fótom de rajo-X, o elétron incidente precisa ter energia suficiente para ionizar o átomo, sendo esta energia chamada de poten cial crítico de excitação,  $E_c$ . Elétrons com energia superlor a  $E_c$  po dem produzir diversas ionizações e assim perder progressivamente ener gia, ou podem ser espalhados elásticamente, sem perda de energia, mas apenas mudando suas direções. Adicionalmente, eles podem ser desacelerados em um campo nuclear de um átomo para produzir radiação contí nua, denominada "bremsstrablung" (25).

A concentração  $Cx_i$  de um elemento  $(x_i)$  em uma amos tra, quando referida a um padrão, é dada por:

 $Cx_{i}^{=} \frac{Ix_{M_{i}}}{Ix_{100_{i}}Cx_{100_{i}}} = \frac{Ix_{M_{i}}}{Ix_{100_{i}}}, \text{ und } \text{ vez que } Cx_{100_{i}}^{=1},$ 

onde Ix<sub>M,</sub> e lx<sub>100,</sub> são as intensidades das emissões características i Quando os clétrons penetram uma amostra espessa (e<u>s</u> pessura maior do que o "caminho livre médic" dos elétrons).numerosos processos ocorrem afetando a produção e coleta dos raios-X da amostra. A equação para o cálculo da concentração elementar é então modi ficada para:

$$Cx_{i} = \frac{c_{X}^{kTx}M_{i}}{C_{Z}^{kT}C_{A}^{kT}C_{F}^{kT}}$$

onde  $Jx_{M_{i}}$  é a intensidade de raios-X du amostra, k é uma constante de pendente<sup>1</sup>da intensidade obtida do padrão, e  $C_{Z}$ ,  $C_{A}$  e  $C_{F}$  são fatores de correção. Estes fatores são necessários, respectivamente, para a correção dos efeitos de número atômico, absorção de raios-X e fluores cência, sendo conhecidos como correções IAF. Os diversos efeitos são descritos a seguir.

2.4.1.1. Efeito do Número Atômice (C<sub>2</sub>)

Os elétrons que atingem a superfície de uma amostra podem penetrar na mesma ou serem espalhados. Os efeitos des tes processos na emissão de raios-X podem ser considerados simplifica damente em termos de dois fatores, R e S. Os elétrons que são espa lhados da superfície da amostra não contribuem para a produção de raios-X. A fração de elétron incidente que penetra a amostra e perma nece nela é chamada R. Amostras de baixo número atómico produzem me nos espalhamento e consequentemente um valor mais alto para R. A produção de raios-X por ionização depende do potencial crítico (E\_) d₽ ionização da amostra, portanto da sua composição. Elementos de peque no número atômico tem um potencial critico de ionização baixo, portan to, são ionizados facilmente e tom grando poder de desaceleração dos elétrons por unidade de massa. O poder de desaceleração da amostra é designado por S e é mais alto para elementos de baixo número atômico. A cnergia inicial (E<sub>o</sub>) dos elétrons afeta

os valores de R e S. Elétrons com energia mais alta podem ser incdia tamente espalhados escapando da amostra, produzindo valores menoselo vados para R; também a capacidade de desaceleração da amostra — pode ser reduzida, causando um valor mais baixo para S.

Então tem-se R e S variando inversamente com

os valores de E<sub>o</sub> e Z. Isto é desejável uma vez que a correção a ser aplicada depende da relação entre R e S. isto é:

$$C_{z} = \frac{R}{S}$$

Alguns autores preferem o desdobramento do fator de correção para o número atômico  $(C_2)$  em deis fatores distintos:

F<sub>b</sub>= Fator de correção do retro-espalhamento,

 $F_{e}$ = Fator de correção do poder de desaceleração.

O fator de correção do retro-espalhamento é dado por:

onde R é o coeficiente de retro-espalhamento. Os valores de R para elementos puros se encontram tabelados segundo Duncumb & Reed<sup>(25)</sup>, em função do número atômico Z e W<sub>o</sub>. O valor W<sub>o</sub> é dado por  $E_c/E_o$ . No caso de compostos o valor R é calcul<u>a</u> do tomando-se como base a concentração média em massa:

O fator de desaceleração é calculado ma prática assumindo-se P<sub>s</sub>= S; então:

$$F_s = \sum \left(\frac{2i}{\lambda i}\right) \ln \left(\frac{1,166}{Ji},\frac{\overline{E}}{\overline{D}}\right)$$

onde o valor de É é dado por:

$$\overline{E} = \frac{(2E_0 + E_c)}{3}$$

Z = número atômico, A = massa atômica.

No caso de compostos o valor. S é calcul<u>a</u> do tomando-se como base a concentração média um massa:

O valor do termo J, potencial de ioniz<u>a</u> ção, tem sido objeto de algumas questões e controvérsias; adota-se geralmente um trabalho de Duncumb (25, cap. 12) que apresenta J em termos de J/Z, como proveniente de uma curva experimental descrita pela equação empírica:

$$J/Z = 14(1 - e^{-0.17}) + \frac{75.5}{z^{2/7.5}} - \frac{Z}{(100 + 1)}$$

Os valores de J para vários elementos se encontram devidamente ta belados.

A magnitude das correções para número at<u>ô</u> mico e flucrescência é raras veles maior que 20%; a correção para absorção pode alcançar porcentagens bem mais altas. Então, a preci são de uma análise quantitativa é altamente prejudicada por umacor reção insatisfatória da absorção<sup>(16)</sup>.

A equação simplificada para o cálculo do fator de correção para absorção é dada por:

$$F_{A} = 1/f(\chi)$$

onde:  $f(\chi) = \frac{1}{(1+\chi/\sigma) [1+h\chi/(1+h)\sigma]}$ 

C

f(X) é a fração dos raios X que são transmitidos pelo alvo, na d<u>i</u> reção do espectrômetro, isto é, a um ângulo e da superfície da amo<u>s</u> tra.

 $\chi = \left[ \sum_{i=1}^{n} Gi \left( \frac{y}{p} \right) \frac{i}{\lambda} \text{ cosec } 0 \right], \text{ onde } \left( \frac{y}{p} \right) \frac{i}{\lambda} \in \mathbb{C} \text{ coefficiente de absorção para a radiação de comprimento de onda x no elemento i.}$ 

 $\sigma$  e h são parâmetros que levam em conta a variação de f(X) com a energia do feixe de elétrons incidente (E<sub>0</sub>) e o número atômico (Z) respectivamente.

O valor de c é dado por:

$$\sigma = \frac{4.5 \times 10^5}{(E_0^{1.65} - E_c^{1.65})}$$

onde  $E_0$  é a energia do feixe de elétrons incidente e  $E_c$  é o poten cial crítico de excitação.

O valor de h é dade por:

$$h = 1, 2 \quad \sum_{i} C_{i} \frac{A_{i}}{Z_{i}}$$

onde Ci é a concentração dos elementos constituintes do alvo: Ai é a massa atômica e Zi é o número atômico.

2.4.1.3 Efeito de Fluorescência (C<sub>p</sub>)

Fluorescência ocorre quando a radiação c<u>a</u> racterística de um elemento A é excitada por fótons de energia mais alta que a energia crítica de excitação de A. Representa normalme<u>n</u> te uma contribuição menor do que os outros fatores, porém não pode ser negligenciada se uma resposta precisa for desejada.

A contribuição da fluorescência é visivel mente aumentada quando a matriz é constituída por elementos com nú mero atômico alto e o elemento a ser medido apresenta número atômi co médio ou baixo. A fluorescência pode ocorrer devido à excitação por meio de linhas características de rajos-X, por intermédio do espectro contínuo de rajos-X, ou por ambos os mecanismos.

Devido a complexidade das correções para flucrescência adotamos, para efeito de correção, a equação geral proposta por Reed & Long (1963). Para esse caso os autores consid<u>e</u> raram uma liga AB, onde uma radiação característica do elemento B é capaz de excitar a linha i do elemento A por fluorescência. A equa ção simplificada para o cálculo do fator de correção para fluores cência é dada por:

 $\mathsf{F}_{\mathsf{f}} = \left[ 1 / \left( 1 + \mathsf{I}_{\mathsf{A}}^{\mathsf{f}} / \mathsf{I}_{\mathsf{A}} \right) \right]^{\mathsf{t}}$ 

O valor de  $l_A^f/I_A$  proposto por Reed & Long é dado por:

$$\frac{J_{A}^{f}}{I_{A}} = 0.5C_{B} \frac{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{B}^{A}}{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{A}^{AB}} = \frac{r-1}{r} \frac{\omega_{k}(B)}{A_{B}} \frac{\frac{A_{A}}{P}}{A_{B}} \frac{\left(\frac{\mu}{B}\right)_{A}}{\left(\frac{\mu}{P}\right)_{A}} = \frac{r-1}{r} \frac{1.67}{A_{B}} \frac{\varepsilon_{N}}{\left(\frac{\mu}{P}\right)_{A}} \frac{(1+u)}{u} + \frac{\varepsilon_{N}(1+v)}{v}$$

onde  $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{B}^{A}$  = coeficiente de absorção em massa do elemento A para a ra diação de B.

- $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)^{AB}_{B}$  coeficiente de absorção em massa da liga AB para a radi<u>a</u> ção de B.
- $C_{\rm B}$  = concentração do elemento excitante B.

 $\left(\frac{U_{B}}{U_{A}}-\frac{1}{1}\right)^{1} \simeq \frac{E_{k}(A)}{E_{k}(B)} = expresso somente como função de E<sub>0</sub> e <math>Z_{B}^{-Z}A$ .

- $E_k(A) \cong$  energia crítica de excitação de elemento A.
- $E_{\tilde{K}}(B) \cong$  energia crítica de excitação do elemento B.

$$\mathbf{u} = \frac{\left(\frac{\mu}{\nu}\right)_{A=cosec}^{AB}}{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{B}^{AB}}$$

- $v = \frac{\sigma}{(u/\rho)} \frac{AB}{B}$   $c = \frac{4}{E_0^1} \frac{5 x}{65} \frac{10^5}{E_c^1}, \frac{65}{65}$
- r = quociente de salto na descontinuidade da absorção "absorption edge jump ratio".
- r-1 fator de eficiência, expressa a parte das ionizações pro duzidas em uma dada camada de um átomo, relativa às ioni cações produzidas pelo mesmo foton em outras camadas ioni záveis.
- wk(B)= fluorescência produzida pelo elemento B, dependente do n<u>u</u> mero atômico e da camada ionizada.
- $A_A = massa atômica do elemento A.$
- A<sub>p</sub> = massa atômica do elemento E.

A quantidade de cálculospode ser reduzida pela combinação dos termos referentes ao elemento excitante e excit<u>a</u> do em um único parâmetro:

$$J(A) = 0, 5 \frac{r_A^{-1}}{r_A} \omega_k(B) \frac{A_A}{A_B}$$

os valores de J(A) se encontram devidamente tabelados, <sup>(25</sup>, cap.15).

## 2.4.1.4 Constante k

A equação para o correção da concentração

elementar tem uma constante (k) que é dependente das característ<u>i</u> cas do padrão. Padrões puros são utilizados normalmente para cada elemento analisado.

$$Cx_{i} = k - \frac{C_{XM_{i}}}{C_{Z}C_{A}C_{F}}$$

Para elementos puros, o efeito de fluores cência não ocorre; assim, executando-se as correções para  $C_2 \in C_A$ , é possível calcular-se a constante k. Tem-se dessa forma todos os dados necessários para se determinar a concentração do elemento na amostra. Introduzindo-se estes dados, juntamente com informações so bre voltagem de accleração dos elétrons, composição elementar da amostra, ângulo de saída dos raios-X produzidos, é possível, por meio de um computador, calcular-se a concentração elementar com r<u>e</u> lativa facilidade.

## 2.5 TECNICAS DE MEDIDAS POR MEIO DE MICROSSONDA ELETRÔNICA

2.5.1 Análise de Superfície Através de Imagens de Raios-X

Além da imagem eletrônica de varredura, os raios-X gerados podem ser também usados para formar uma imagem. Para tanto o espectrômetro de raios-X é posicionado, selecionando-se o ângulo e com o cristal de difração adequado para detectar uma única linha característica (de um único elemento). À medida que o feixe de el<u>é</u> trons primários é varrido sobre a amostra uma imagem vai sendo fo<u>r</u> mada. Essa imagem será um mapeamento representando a distribuição do elemento atravês da amostra.

A informação de raios-X gerada em cada ponto da amos tra modula a intensidade dos pontos na tela formando assim,uma di<u>s</u> tribuição de intensidades relativas. Quando a concentração do el<u>e</u> mento analisado é baixa, deve-se aumentar o tempo de varredura.

Normalmente medidas através das imagens de raios-X são utilizadas quando os elementos presentes na amostra estão em concentração superiores a 5º<sup>(4)</sup>.

Esse tipo de imagem possibilita a determinação da distribuição e frequência de ocorrência das heterogeneidades presen tes por meio da análise de diversas secções representativas de con siderável área da amóstra. Com esses dados é possível a construção

INSTITUTO OF PESQUICAS ENERGETICAN & NUCLEARCES .

de histogramas e a determinação de valores médios e máximos das he terogeneidades presentes.

As desvantagens desse tipo de imagem são a impo<u>s</u> sibilidade de se distinguir pequenas diferenças de concentrações, e de se detectar elementos existentes em pequenas quantidades.

#### 2.5.2 Análise em Uma Linha por Varredura Mecánica

Neste tipo de medida o feixe eletrônico o mantido estacionário: os espectrômetros são selecionados nos ângulos O ade quados para detectarem as radiações de comprimento de onda dos el<u>e</u> mentos a serem medidos e a amostra é movida mecanicamente sob o feixe ao longo de uma linha pré-determinada.

O registro dos sinais de raios-X é executado por meio de um registrador potenciométrico, de tal modo que é possível a medida simultânca da intensidade das radiações características de dois elementos, além da corrente da amostra. A medida de intensid<u>a</u> de das radiações características permite o calculo semi-quantitat<u>i</u> vo das concentrações dos elementos. O registro da corrente na amo<u>s</u> tra fornece indicações sobre o estado da superfície, como porosid<u>a</u> de, diferenças de densidade, etc.

Analisando-se o registro obtido, por meio dos val<u>o</u> res das larguras à meia altura dos picos presentes, pode-se obter a ordem de grandeza das heterogencidades presentes.

#### 2.5.3 Análise em Um Ponto

Considerando-se que a imagem de raios-X formada por varredura fornece indicações sobre quais os elementos presentes na amostra, tal imagem pode somente dar informações qualitativas ou, quando muito, semi-quantitativas. O método envolvendo uma varredura linear proporciona relativa quantificação por meio da análise das linhas de varredura sobre a amostra. Porém, se uma análise quant<u>i</u> tativa for necessária, especialmente quando as intensidades de raios-X são baixas, faz-se o registro dos dados com o feixe mant<u>i</u> do estacionado sobre cada ponto localizado em áreas pré-selecion<u>a</u> das da amostra. O tempo de contagem em cada ponto varia de 10 a 100 segundos, dependendo das intensidades dos raios-X emitidos. Para e<u>s</u> te tipo de medida é necessário o uso de padrões.

A intensidade do elemento medido, I, que está rela cionada à sua concentração, é dada por I= I<sub>P</sub>-I<sub>B</sub>. A intensidade devida ao "background" é medida à um ângulo  $\theta_{\rm B} = \theta_{\rm p} \pm 5^{\circ}$ , observando-se sempre se não há outro elemento na amostra, cuja linha caracterí<u>s</u> tica possa interferir na medida da radiação de fundo.

Procedimento semelhante é utilizado para a medida da intensidade correspondente aos padrões, observando-se a seguin te sequência:

- intensidade dos padrões
- intensidade do "background" para os padrões
- intensidade dos elementos na amostra
- intensidade do "background" para os elementos

Com os dados obtidos calcula-se a relação I/I<sub>o</sub>, chamada de comp<u>o</u> sição elementar, a qual juntamente com informações sobre voltagem de aceleração dos elétrons e ângulo de saída dos raios-X produz<u>i</u> dos permite, utilizando-se o método de correção ZAF,o cálculo das concentrações elementares na amostra.

Frequentemente a combinação dos três modos de ope ração é necessária. As imagens de raios-X formadas por varredura indicam as áreas de interesse na amostra em termos dos elementos constituintes; a análise em uma linha na superfície da amostra, in dica a distribuição local dos elementos e a análise nor ponto per se mite uma determinação quantitativa em pequenas regiões.

125.

3. PARTE EXPERIMENTAL

Fastilhas de U0<sub>2</sub>-Th0<sub>2</sub> foram preparadas a partir de misturas de pós de U0<sub>2</sub> e Th0<sub>2</sub> (1,9, 12, 13, 21, 22, 36, 38).

3.1. Preparação dos Pós

Os óxidos de urânio e de tório foram preparados a partir de diuranato de amônia (DUA) e de oxalato de tório, ambos procedentes do Departamento de Engenharia Química do IPEN-CNEN/SP. Análises quí micas típicas desses materiais são apresentadas na Tabela 3.1.

ELEMENTO	DUA (ug/g de U)	OXALATO DE TÓRIO (ug/g de ThO <sub>2</sub> )
	<< 14	< 5
Si	~ 10	6,4
Mn	< 1	<0,5
В	<0,1	< 1
Mg	< 2	1,6
РЪ	- 20	1.4
Ag	<0,1	5,2
Sr	-	100
Cd	<0,5	1,8
Cr	< 3	1
Na		14
ր	< 55	-

TABELA 3.1 - Análise Química dos Compostos Fornecida pelo DEQ do IPEN-CNEN/SP. 3.1.1 Preparação do UO2

O pó de DUA foi calcinado em forno de resistência elé trica, ao ar durante 2 horas a uma temperatura máxima de 660 °C , com uma porda de massa total de 19% (13% de água).

Em seguida o pó de  $U_3 \theta_8$  obtido na calcinação foi reduzido para obtenção de  $U \theta_2$ . A operação de redução foi realizada em fornos tubulares de 10cm de diâmetro e cerca de 3,5m de comprimento, sob atmosfera de hidrogênio, à temperatura máxima de 800  $^{\rm O}$ C durante 1 hora.

3.1.2 Preparação do Th0<sub>2</sub>

O pó de oxalato de tório foi calcinado seguindo o mesmo procedimento empregado para o DUA, com uma perda de massa to tal de 47%. A perda considerando-se somente a equação química de decomposição deveria ser de 48%. O ThO<sub>2</sub> obtido, foi consideradosa tisfatório, pois materiais eventualmente remanescentes após a cal cinação, seriam eliminados durante a sinterização realizada em tem peraturas da ordem de 1650 <sup>O</sup>C.

3.2 Preparação dos Corpos de Prova

A fração menos 150 mesh dos óxidos obtidos foi separada m<u>e</u> diante peneiramento em classificador "Produtest" durante 30 min<u>u</u> tos. Os resíduos foram triturados em almofariz até passarem completamente pola peneira. As proporções dos óxidos presentes foram ca]cu]adas, e estes foram pesados, para produzir uma composição final nas pasti]has de 10, 50 e 90% em peso de ThO<sub>2</sub>.

Os pós de óxidos devidamente pesados foram misturados a sē co em um misturador "Mixer-R-Mill" (Spex Industries, Inc.) dura<u>n</u> te 30 minutos.

3.2.1 — Compactação e Caracterização dos Corpos de Prova 🚊

Os corpos de prova em forma de pastilhas foram obti dos pela compactação das misturas dos pos em prensa manual, empr<u>e</u> gando-se matriz de aço para compactação com duplo efeito (matriz flutuante). O diâmetro da matriz é de l0mm e pressão igual a 62MPa.

.25.

A Tabela 3.2 apresenta os valores obtidos para a den sidade a verde dos corpos de prova constituídos pelas diferentes místuras.

TABELA 5.2 - Valores de Diāmetro, Espessura, Massa, Densidade a Verde e de Porcentagem de Densida Teórica (P<sub>T</sub>) das Pastilhas de Urânia-Tória com 10,50 e 90% de Tória.

\$ Tória	¢ (10 <sup>-1</sup> cm)	h (10 <sup>-1</sup> cm)	m (g)	pa Verde (g/cm <sup>3</sup> )	\$ PT*
30	10,1 ± 0,1	6,6 ± 0,1	2,983	5,64	  52,0 ± 1,4
50	10,1 ± 0,1	6,5 = 0,1	2,991	5,75	55,7 1,4
50	10,1 ± 0,1	6,5 ± 0,1	2,984	5,74	55,6 ± 1,4
90	10,1 + 0,1	7,0 ± 0,1	3,003	5,36	54,6 ± 1,3
90	10,1 ± 0,1	6,9 ± 0,1	3,000	5,39	54,9 + 1,3
	 ! 			 	! 

$$p_{\pi}$$
 = Densidade Teórica Calculada Conforme Apéndice 1.

3.2.2 Sinterização e Caracterização das Pastilhas Sinteri zadas

As pastilhas foram sinterizadas a uma temperatura de 1650 <sup>O</sup>C durante 3 horas, sob atmosfera de argônio. Utilizou-se um forno "Wild Barfield" de resistência tubular de tungstênio. A tem peratura foi medida com um pirômetro ótico, através de uma jancla de vidro com auxílio de um espelho e um prisma. A atmosfera de ar gônio foi mantida com pressão e vazão constantes de aproximadamen te 21 KPa e 1 l/min respectivamente. As velocidades de aquecimen to e resfriamento foram de 20 <sup>O</sup>C/min. A Tabela 3.3 apresenta os valores obtidos para a de<u>n</u> sidade das pastilhas sinterizadas.

TABELA 3.3 - Valores de Diâmetro, Espessura, Massa, Densidade após Sinterização e Porcentagem de Densidade Teórica das Pastilhas de Uránia-Tória com 10.30, 90% de Tória.

% Tória	¢	h (10 <sup>-1</sup> cm)	лі (с)	ρ (ε/cm <sup>5</sup> )	\$p <sub>T</sub>
10	$(10 \ cm)$	$5,30 \pm 0,1$	2,954	10,30	95,0 ± 3,1
50	8,4 ± 0,1	5,45 ± 0,1	2,935	9,72	94,2 + 2,9
50	8,4 ± 0,1	5,45 - 0,1	2,929	9,70	94,0 ± 2,9
90	8,4 ± 0,1	6,05 ± 0,1	2,940	8,77	89,3 ± 2,6
90	8,4 ± 0,1	6,00 ± 0 <b>,1</b>	2,922	8,79	89,5 + 2,6

 $p_{\pi}$  = Densidade Teórica Calculada Conforme Apéndice 1.

A Figura 3.1 mostra a relação entre a % da densidade teórica alcançada e a % de ThO<sub>2</sub>.



.21.

## 3.3 Preparação das Amostras para Ceramografia

Todas as amostras foram preparadas por meio da técnica de embutimento e polimento mecânico.

O embutimento foi feite a quente (- 150  $^{\circ}$ C), empregando -se baquelita. Em seguida os corpos de prova embutidos foram polidos, de início mecânicamente utilizando placa de vidro impregnada com carbeto de silício de 400 um, seguindo-se polimento semi-automáti co em politriz, com pano de algodão e abrasivo de diamente de 6 e l um; o acabamento final foi dado em polítriz automática, com pa no de nylon e alumina gama de 0.05 µm.

## 3.4 Recobrimento

As amostras foram recobertas com grafite. Esse recobrimento teve as seguintes finalidades:

- a) Aumentar a condutividade clétrica da amostra cerámica e prevenir a deflexão do feixe eletrônico por carregamento eletrostático;
- b) Aumentar a condutividade térmica e prevenir um aumento localizado de temperatura na amostra, e uma possível rea ção da amostra com depósitos de hidrocarbonetos que são resultantes da decomposição do vapor de óleo residual das bombas de difusão.

## 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das amostras preparadas para estas medidas, apenas a de com posição nominal 90%  $ThO_2 = 10\% UO_2$  apresentou heterogeneidades (par tículas grandes ou aglomerados) consideráveis. Devido ao método de preparação usado em escala de laboratório, as domais amostras se apresentaram bastante homogêneas.

Como referência de amostra heterogênea foi analisada uma de composição nominal 80% UO<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub><sup>\*</sup> preparada por compactação a quente.

Parte dos dados utilizados neste trabalho foram compilados durante estágio "Europäiches Institut Für Transurane". Nesse labo ratório foi utilizada uma microssonda eletrônica Cameca-MS46.

#### 4.1 Resultados Obtidos por Meio das Imagens de Raios-X

Para estas medidas foi utilizado cristal de difração PET. As linhas consideradas foram  $M_g$  de primeira ordem para o urânio, ocorrendo o pico à distância  $L^* = 214.75 \text{ mm}$ ; e  $M_{01}$  de primeira ordem para o tório, ocorrendo o pico à distância  $L \approx 239,20 \text{ mm}$ . A voltagem utilizada foi de 10 kV para as imagens de elétrons absor vidos e 25 kV para as imagens de rajos-X.

a) Amostra com composição nominal 80% UO2 - 20% ThO2

Cinco diferentes regiões foram analisadas e as imagens obtidas são mostradas nas Figuras 4.1 a 4.5.



(a)





(5)

FIGURA 4.1 - Região I, mostrando heterogeneidades ricas em Ťh, a maior delas com aproximadamente 400 µm.

(a) Imagem de elétrons absorvidos (100 x)
(b) Imagem de R-X U (100 x)
(c) Imagem de R-X Th (100 x)







(c)

(b)



FIGURA 4.2 - Região II, mostrando heterogeneidades ricas em U, a maior delas com aproximadamente 300 µm e heterogenei dades ricas em Th, com cerca de 120 µm.

- (a) Imagem de elétrons absorvidos (100 x)
- (b) Imagem de R-X U (100 x)
- (c) Imagem de R-X Th (100 x)



FIGURA 4.3 - Região III, mostrando heterogeneidades ricas em U, notando-se apenas três heterogeneidades ricas em Th, duas delas com cerca de 80 µm. As heterogeneidades são aproximadamente lenticulares e com mesma orien tação.
 (a) imagem de elétrons absorvidos (100 x)

- (b) Imagem de R-X U (100 x)
- (c) Imagem de R-X Th (100 x)



- FIGURA 4.4 Região IV, mostrando heterogeneidade rica em U, com aproximadamente 400 µm, com um lado orientado segun do a direção das demais heterogeneidades de U e Th.
  - (a) Imagem de elétrons absorvidos (100 x)
  - (b) Imagem de R-X = U (100 x)
  - (c) Imagem de R-X Th (100 x)



(a)



(c)



(b)

FIGURA 4.5 - Região V, típica da amostra, mostrando que as hetero geneidades ricas em U são mais abundantes e maiores que aquelas ricas em Th.

- (a) Imagem de elétrons absorvidos (100 x)
- (b) Imagem de R-X U (100 x)
- (c) Imagem de R-X Th (100 x)



FIGURA 4.6 - Imagens de raios-X de urânio (4,1,2,3,4,5b) amostra 80% UO<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub> nominal.



. ·



(a)

Soμm

(c)



(b)

FIGURA 4.8 - Região I, mostrando poucas heterogeneidades ricas em U; as regiões brancas na imagem de elétrons absorvidos correspondem à poros.

- (a) Imagem de elétrons absorvidos (200 x)
- (b) Imagem de R-X U (200 x)
- (c) Imagem de R-X Th (200 x)



- ricas em U da ordem de 5 a 20µm.
  - (a) Imagem de elétrons absorvidos (400 x)
  - (b) Imagem de R-X U (400 x)
  - (c) Imagem de R-X Th (400 x)

![](_page_47_Figure_1.jpeg)

FIGURA 4.10 - Região II, mostrando como na Figura 4.9 poucas n<u>e</u> terogencidades riças em U, que ocorrem goralmente associadas as regiões porosas.

- (a) Jmagem de elétrons absorvidos (800 x)
- (b) Imagem de R-X U (800 x)
- (c) Imagem de R-X Th (800 x)

![](_page_48_Figure_1.jpeg)

- 10µm.
- (a) Imagem de elétrons absorvidos (800 x)
- (b) Imagem de R-X U (800 x)
- (c) Imagem de R-X Th (800 x)

Com o objetivo de confirmar as modidas efetuadas na micros sonda eletrônica, a mesma amostra de composição nominal 80% UO<sub>2</sub> -20% ThO<sub>2</sub> foi observada em um microcópio ótico. Diversas regiões foram analisadas mas apenas uma, que apresentou melhor contraste entre as áreas ricas em UO<sub>2</sub> e ThO<sub>2</sub> foi escolhida referência, Fig<u>u</u> ra 4.32.

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

FIGURA 4.12 - Imagem offica da amostra 80%  $UO_2$  - 20% ThO<sub>2</sub> nominal (160 x)

As regiões claras correspondentes a aglomerados de UO<sub>2</sub> foram transpostas para papel transparente, a fim de melhorar o contra<u>s</u> te, Figura 4.13, e subsequentemente classificadas manualmente em um analisador de tamanhos de partículas TG2-3 (Carl Zeiss).

![](_page_49_Picture_4.jpeg)

FIGURA 4.13 - Imagem ótica da amostra 80% UO<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub> nominal (160 x)

Efetuadas as medidas, o respectivo histograma dos diâmetros equivalentes as áreas foi construído, Figura 4.14.

![](_page_50_Figure_2.jpeg)

FIGURA 4.14 - Histograma de distribuição das heterogeneidades ricas em urânio derivado da imagem ótica.

Neste histograma observa-se um valor médio das heterogene<u>i</u> dades de aproximadamente 21µm. O tamanho máximo observado foi de aproximadamente 130µm. Tomando-se como base os histogramas de distribuição obtidos por meio das imagens de raios-X, Figura 4.7 e da imagem ótica, F<u>i</u> gura 4.14, determinou-se os valores percentuais  $A_A$  correspondentes as áreas de heterogeneidades ricas em urânio, relativamente a área total  $A_T$  considerada<sup>(35)</sup>.

As áreas das heterogeneidades foram calculadas por integra ção gráfica, sendo  $\phi_i$  o valor médio no intervalo i do histograma e N<sub>i</sub> o número do partículas correspondente. Os valores percentuais A<sub>a</sub> são dados por:

$$\frac{\sum \mathbf{e}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{i}}}{\mathbf{A}_{\mathrm{T}}} \cdot 100$$

Do histograma de distribuição derivado das imagens de raios-X tem-se:

$$\frac{1,15 \times 10^{-2}}{3,43 \times 10^{-2}} \times 100 = .33,6\%$$

Do histograma de distribuição derivado da imagem ótica temse:

$$\frac{1.11 \times 10^{-3}}{2.94 \times 10^{-3}} \times 100 = 37.6\%$$

A área das heterogeneidades ricas em urânio pode ainda ser determinada pelo método de análise linear, L<sub>L</sub>. Considerou-se p<u>a</u> ra essa determinação duas imagens, uma obtida por raios-X, Figura 4.15 e outra óticamente, Figura 4.16.

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

FIGURA 4.15 - Imagem de raios-X de urânio (100 x) Amostra 80% U0<sub>2</sub> - 20% Th0<sub>2</sub>.

![](_page_52_Picture_2.jpeg)

FIGURA 4.16 - Imagem Ótica (160 x) Amostra 80% U0<sub>2</sub> - 20% Th0<sub>2</sub>. O emprego da análise linear é mais adequado quando as cara<u>c</u> terísticas microestruturais de interesse se apresentam em áreas grandes relativamente à área considerada, e se aplica diretamente as amostras analisadas.

A designação  $L_1$ , em análise linear, associa-se ao fato de que comprimentos entre intersecções são medidos ao longo de linhas retas, aleatóriamente traçadas através da microestrutura. Os com primentos individuais dos correspondentes segmentos interceptados são medidos separadamente, adicionados e comparadas com o comprimento total da linha<sup>(35)</sup>.

Os valores  $L_{\underline{L}}$  medidos para as heterogeneidades ricas em ur $\underline{\bar{a}}$  nio foram:

 $L_L = 36.1\%$  (Imagem de raios-X)  $L_1 = 32.8\%$  (Imagem ótica)

Em metalografia quantitativa ou ceramografia são válidas as relações<sup>(5,35)</sup>:

 $L_L = A_A = V_V$ 

O desvio percentual relativo a média dos valores  $A_A$  calcul<u>a</u> dos é 5,6%. Para os valores  $L_L$  medidos o desvio percentual relati vo a sua média é 4,8%. A média para os quatro valores obtidos , usando a relação  $A_A = L_L$  é 35 ± 2%. Por conseguinte, as hetero geneidades ricas em UO<sub>2</sub>, déterminadas por microssonda eletrônica e microscopia ótica, diferem de menos 5%, no nível de aproximad<u>a</u> mente 70% de confiança. Em termos de diâmetros médios equivalen tes, para as determinações efetuadas sobre a imagem ótica, tem-se:

D<sub>1</sub> = 21µm (determinação a partir do histograma de distribui - ção na Figura 4.14);

 $D_2 = 25\mu m$  (determinação a partir da área  $A_A = 37,6\%$  calculada anteriormente);  $D_2 = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$ ;

 $D_3 = 23\mu m$  (determinação usando o método das intersecções,  $L_L = A_A = 32,8$ );  $D_3 = \sqrt{\frac{4A_A}{-\pi}}$ . Portanto  $\tilde{D} = 23 \pm 2\mu m$ , com um desvio em relação a média de 8,6%. Este resultado é compatível com aqueles normalmente obtidos em trabalhos de pesquisa básica envolvendo metalografia quantita tiva<sup>(5)</sup>. Consequentemente há compatibilidade entre os resultados obtidos e os procedimentos analíticos adotados para análise de imagens.

## 4.2 Resultados Obtidos por Meio da Análise em uma Linha Correspon dente a Varredura Mecânica

Para análise em uma linha correspondente a varredura mecâni ca foram utilizados cristais de difração de quartzo 1011 nos es pectrômetros 1 e 2. O tório foi analisado no espectrômetro 1, con siderando-se a linha  $M_{\alpha 1}$  de primeira ordem; ocorrendo o pico à dis tância L = 309,6mm; o urânio no espectrômetro 2, tomando-se a li nha  $M_{\beta}$  de primeira ordem, ocorrendo o pico à distância L = 278,0mm. A voltagem utilizada foi 20 kV; com a corrente da amostra igual a 100 nA. Deslocaram-se a amostra e o papel com velocidades respe<u>c</u> tivamente iguais a 32 um/min e 2 cm/min.

Analisando-se os perfis de concentração semi-quantitativos, • Figura 4.17, obtidos para a amostra de composição nominal 90%ThO-IO% UO<sub>2</sub>, observou-se um tamanho médio das heterogeneidades ricas em urânio igual a 7 ± 4µm (considerando-se apenas os picos maiores ou iguais a 2 vezes a amplitude daqueles correspondentes à ma triz homogênea). Este tamanho médio das heterogeneidades se encon tra em concordância com o constatado nas imagens de raios-X. Foi possível também determinar-se o espaçamento médio entre as hetero geneidades; obteve-se o valor 90 + 72 µm.

A concentração média dos elementos, não consideradas as he terogeneidades, permanece praticamente inalterada ao longo da li nha varrida (- 2200µm). Analisando-se a linha correspondente à corrente da amostra, observa-se que a superfície se apresenta pou co porosa e que as heterogeneidades presentes ocorrem geralmente associadas à regiões de maior porosidade. Este mesmo comportamento foi verificado anteriormente através das imagens de raios-X. Tam bém não foram observadas regiões com diferenças de densidade, face a constância dos valores de corrente da amostra. Em geral, em qual quer ponto do perfil é possível se obter semi-quantitativamente a concentração dos elementos presentes.

![](_page_55_Figure_0.jpeg)

![](_page_55_Figure_1.jpeg)

.50.

No caso da amostra de composição nominal 80% UO2 - 20% ThC. as condições de análise foram mantidas, conforme descrito em 4.2. Analisando-se os porfis de concentração obtidos, Figuras 4.18 e 4.19, observa-se uma distribuição bem mais variável ao longo d۵ linha varrida (= 2700 µm) do que no caso anterior, Figura 4.17. Um número maior de heterogeneidades foi interceptado, tendo a naior delas uma dimensão com aproximadomente 400 µm, Figura 4.19. Podese também observar que, devido à quantidade de heterogeneidades presentes, é bem mais difícil determinar-se semi- quantitativamen te a concentração média dos elementos na amostra. Considerando-se a linha correspondente à corrente da amostra, constatou-se que sua superfície se apresenta pouco porosa e que neste caso não se pode associar as regiões porosas às heterogeneidades presentes. Cono no caso anterior não foram verificadas regiões com diferenças de densidades.

100

FIGURA 4.18 - Perfis de Concentração de The U (Amostra 80% UO<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub> Maminal)

100

![](_page_58_Figure_0.jpeg)

![](_page_58_Figure_1.jpeg)

#### 4.3 Resultados Obtidos por Meio da Análise em um Ponto

As determinações foram efetuadas conforme procedimento men cionado em 2.5.3; os padrões utilizados se encontrvam sob a forma de óxidos e as condições empregadas nas medidas foram as seguintes:

- Padrão Th0<sub>2</sub>: cristal de difração quartzo 1011; espectrôme tro 1; linha medida M<sub>α1</sub> de primeira ordem ocorrendo o pi co à distância L ≃ 309,6mm; tempo de contagem igual a 10 segundos.
- Padrão U0<sub>2</sub> : cristal de difração quartzo 1011; espectrôm<u>e</u> tro 2; linha medida M<sub>β</sub> de primeira ordem ocorrendo o p<u>i</u> co à distância L  $\simeq$  278,0mm; tempo de contagem igual a 10 segundos.

Para as medidas das intensidades de urânio e tório na amo<u>s</u> tra, as condições foram mantidas exatamente iguais às dos padrões, sendo que apenas o tempo de contagem em cada ponto foi aumentado para 50 segundos.

No caso da amostra de composição nominal 90%  $\text{ThO}_2 - 10\% \text{ UO}_2$ , devido a sua menor heterogeneidade , foram efetuadas medidas em 7 pontos aleatóriamente escolhidos na matriz, sendo a contagemem cada ponto feita 5 vezes. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.3.1.

Para a amostra de composição nominal 80% UO $_2$  - 20% ThO $_2$ , a escolha de regiões representativas a serem analisadas foi bem mais complexa. Na Figura 4.20 são mostradas as regiões ou pontos onde efetuaram-se medidas.

![](_page_59_Picture_7.jpeg)

FIGURA 4.20 - Regiões escolhidas para análise quantitativa

.53.

Na região 1, localizada sobre uma heterogeneidade rica em ThO<sub>2</sub>, analisaram-se 10 pontos aleatóriamente escolhidos, e cinco pontos nas regiões 2, 3 e 4 respectivamente. Nas regiões 5 e 6, correspondentes à matriz de composição mais uniforme consideraram se em cada uma 5 pontos. Nas regiões 7 e 8 foram feitas medidas por varredura em áreas pré-selecionadas na imagem de raios-X em zonas menos heterogêneas, utilizando-se un sumento de 8000 x, cor respondendo a uma área na amostra de 100  $\text{um}^2$ .

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.3.2.

TABELA 4.3.] - Análise quantitativa da amostra de composição n<u>o</u> minal 90% ThO<sub>2</sub> - 10% UO<sub>2</sub>.

- I = intensidade do elemento considerado na amos
  tra
- $I_0$  = intensidade do padrãc<sup>\*</sup> JhO<sub>2</sub> = 40018.69 UO<sub>2</sub> = 39892.30

			·	<u>,</u>
Th	]	I/I (%)	ZAF (%)	Correção Normalizada (%)
1	 	94,817	83,518	91,858
Z	37545,16	93,819	82,592	93,928
3	37875,18	94,644	83,300	94,701
4	37415,83	93,495	82,308	93,878
5	39191,00	97,932	86,149	96,479
6	37324,30	93,267	82,083	94,899
7	37860,17	94,606	83,210	97,042
U		·	}!	· · _
1	1820,67	4,564	7,405	8,142
2	1299,67	3,258	5,339	6,072
3	1130,33	2,833	4,661	5,300
4	1306,80	3,276	5,367	6,121
S	755,33	1,893	- 3,144	3,521
6	1068,80	2,679	4,412	5,101
7	607,67	1,523	Z,536	2,958
1				

\* Contagens em 50 segundos.

TABELA 4.5.1 - Análise quantitativa da amostra de composição ng minal 80% U0<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub>. I = intensidade do elemento considerado na amos tra l<sub>o</sub>= intensidade do padrãor - ThO<sub>2</sub> = 58146.00 UO<sub>2</sub> = 41405.30

Th	I	1/I_0 (%)	2AF (%)	Correção Normalizada (%)
1	36764,65	96,379	84,799	95,845
2	35698,49	93,584	82,388	93,826
3	39,50	0,104	0,094	0,106
4	2,33	0,006	0,005	D,006
5	12129,00	31,796	28,478	32,557
6	6426,00	16,846	15,152	17,209
7	8016,40	21,015	18,881	21,323
8	8807,20	23,088	20,729	Z3,900
2		r		
1	919,75	2,221	3,677	4,155
ż	1208,07	2,918	5,422	6,174
3	41716,92	100,752	88,232	99,894
4	43460,83	104,964	92,531	t 5 99,994 [
5	21491,00	\$1,904	58,994	67,443
6	29719,50	71,777	72,899	82,791
7	27530,80	66,481	69,665	78,677
8	25586,70	61,796	66,001	76,100

\* Contagem em 50 segundos.

· •

Da tabela 4.3.1 calculando-se a concentração em peso média (coluna ZAF), encontramos para tório 85.3 ± 1.4% e para uránio 4.7 ± 1.6%. As concentrações em peso calculadas da relação estequio métrica são iguais a 79.1% para tório e 8.81% para urânio. A con centração mais baixa de urânic na matriz pode ser explicada — pelo fato deste sogregar-se nas heterogeneidades, conforme observado per meio das imagens de raios-X e varredura mecânica. Consequentemente à diminuição da concentração de urânio na matriz há um aumento na concentração do tório.

Para a amostra com 80%  $UO_2 = 20\%$  Th $O_2$  (Tabela 4.3.2) somen te as regiões mais uniformes, correspondente aos pontos 6 e 7 re presentam a matriz. Destes obtem-se a concentração om peso média para tório igual a 17.0 4 2.6% e para urânio 71.3 ± 2.3%. As con centrações em peso calculadas da estequiometria são iguais a 17.6% para tório e 70.5% para urânio.

Observa-se que as concentrações obtidas na análise por microssonda e da relação estequiométrica se encontram próximas, com um erro de 5% considerando-se o tório e l% considerando-se o ur<u>â</u> nio.

.5-.

#### 5. CONCLUSÕES

1. A microssonda eletrônica se apresenta como alternativa sa tisfatória para a determinação de heterogeneidades en combustíveis cerámicos, permitindo evidenciar com clareza regiões ricas em urã nio ou tório, em dispersões U0, - Th0,, com dimensões de até 3um.

 2. O método de ceramografia ética usado no estudo das het<u>e</u> rogeneidades não teve a mesma clareza de definição mas,aplicado a uma região particular da amostra de composição nominal 80% U0<sub>2</sub> -20% Th0<sub>2</sub>, permitiu verificar coerência dos resultados.

3. Por intermédio das imagens de raios-X da amostra com 80%  $UO_2 = 20\%$  ThO<sub>2</sub> foi determinado a partir do histograma de distr<u>i</u> buição dos diâmetros equivalentes as áreas das heterogeneidades ricas em urânio, um valor médio igual a 27 ± 2µm.

Pela análise ceramográfica de uma região desta mesma amo<u>s</u> tra determinou-se, por diferentes métodos, um valor médio de di<u>a</u> metro das heterogeneidades ricas em urânio igual a 23 · 2um. Este , resultado é coerente com aquele obtido por microssonda.

4. Na amostra com composição nominal 90%  $\text{ThO}_2$  - 10%  $\text{UO}_2$ , es imagens de raios-X indicaram que as heterogeneidades presentes , com dimensões inferiores a 20µm, são sempre ricas em uránio, e ocorrem associadas a regiões de maior perosidade. A concentração de heterogeneidades é consideravelmente inferior âquela existente na amostra de 80%  $\text{UO}_2$  - 20% ThO<sub>2</sub>.

5. Os perfis de concentração de urânio e tório obtidos na microssonda indicaram para a amostra com 90% Th $\theta_2$  - 10% U $\theta_2$ , hete rogeneidades ricas em urânio com tamanho médio igual a 7 ± 4µm e um espaçamento médio entre elas igual a 90 + 72µm. A concentração média dos elementos permaneteu constante au longo da linha varrida. A amostra é pouco porosa e as heterogeneidades ricas em ur<u>â</u> nio ocorrem geralmente associadas às regiões de maior porosidade, conforme observado nas imagens de raios-X.

Para a amostra com 80% UO<sub>2</sub> - 20% ThO<sub>2</sub>, a concentração de heterogeneidades é muito maior que no caso anterior, alcançando dimensões de até 400µm; a porosidade é menor. Não se pôde associar as regiões porosas às heterogeneidades presentes.

Para a amostra com 80%  $UO_2 - 20$ % Th $O_2$  apenas regiões com distribuição mais uniforme, préviamente escolhidas e analisadas por varredura em área ( $100\mu m^2$ ), são representativas da matriz. Os respectivos valores das concentrações de uránic e tório se enco<u>n</u> tram próximos aos calculados da relação estequiométrica, com erro de 3% para tório e 1% para urânio.

## APÉNDICE 1

## Densidade Teòrica

A densidade teórica das pastilhas constituídas pela mistura física dos óxidos ThO<sub>2</sub> e UO<sub>2</sub> foi calculada através da ex pressão:

$$a_{t} = \frac{1}{\frac{x}{\rho_{ThO_2}}} + \frac{1}{\rho_{UO_2}}$$

onde: x é a fração em peso de tória na mistura;

1 - x é a fração em peso de urânia na mistura.

<sup>o</sup> ThO<sub>2</sub> e <sup>p</sup> SãO, respectivamente, as densidades cristalográficas da tória e uránia.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AKUTSU, H.: YOSHIOKA, K.; NAKAMURA, Y. Preparation of lower density U0<sub>2</sub>-Pu0<sub>2</sub> pellets. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. <u>Plotonium as a reactor fuel: proceedings of a</u> <u>symposium on..., held in Brussels, March 13-17,1967</u>. Vienna, 1967. p. 335-46.
- BIRKS, L.S. <u>Electron probe microanalysis</u>. New York, Interscience, 1963.
- BIRKS, L.S. <u>Electron probe microanalysis</u>. New York, Interscience, 1971. Capítulo 7 p.101-123.
- CHANDLER, J.A. <u>X-ray microanalysis in the electron microscope</u> practical methods in electron microscopy. Amsterdan, North-Holland, 1977. Capitulo 2, 3 p. 351-374.
- DeHOFF, R.T. & RHINES, F.N. <u>Quantitative microscopy</u>.New York, MacGraw-Hill, 1968. Capítulo 3,7 p. 45-50; 235-250.
- FERRAN, G. Análise por microssonda eletrônica. <u>Rev. Bras.</u> Tecnol., <u>4</u>: 41-67, 1973.
- 7. FREITAS, C.T. Comunicação pessoal.
- GREEN, D.R.; RASMUSSEN, D.E.; GRAY, W.H. <u>Autoradiographic</u> measurement of Pu distribution in mixed oxide nuclear fuel. Sem local, 1976. (HEDL-TME 76-53).
- 9. HAYDT, H.M.; CAPOCCHI, J.D.T.; MORAES, E.; GENTILE, E.F. <u>Sin-</u> terização <u>de pastilhas de Th0<sub>2</sub> e de soluções sólidas</u> <u>U0<sub>2</sub> -</u> <u>Th0<sub>2</sub></u>. São Paulo, 1971. (IEA - Pub. 236).
- 10. HENOC, J. & MAURICE, F. Practical quantitative analysis of bulk specimens. In: Microanalysis and Scanning Electron Microscopy. Summer School St. Martin-d'H'eres, Sept. 11-16, 1978. Edited by Maurice, F.: Meny, L.; Tixier, R. (1979) p. 281-317.
- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. <u>Utilization</u> of thorium in power reactor; report of a panel on...., held in Vienna, June, 1965. Vienna, 1966. p. 1-9.
- 12. JEFFS, A.T.; BOUCHER, R.R.; NORLOCK, L.R. Fabrication of U02-Pu02 and Th02-Pu02 experimental fuel: In: INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY. <u>Plutonium as a reactor fuel: proceedings</u> of a symposium on..., held in Brussels, <u>March</u>, 13-17,1967.Vienna, 1967. p. 179-88.

- 13. KARKHANAVALA, M.D. & MOMIN, A.C. The formation of urania-thoria solid solutions. <u>J. Nucl. Mater.</u>, <u>11</u>: 114-16, 1964.
- 14. KAUFMANN, A.R. <u>Nuclear reactors fuel element: metallurgy and</u> fabrication. New York, Interscience, 1962.
- 15. LANE, J.A. Economic incentive for thorium reactor development In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. <u>Utilization</u> of <u>thorium in power reactor: report of a panel on...,held in</u> <u>Vienna, June 1965</u>. Vienna, 1966. p.199-211.
- 16. LOVE, G.; COX, M.G.C.; SCOTT, V.D. Assessment of Bishop's absorption correction model in electron probe microanalysis. J.Phys.D: Appl.Phys., <u>9</u>: 7-13, 1976.
- 17. MAURICE, F. X-Ray emission. In: Microanalysis and Scanning Electron Microscopy. Summer School St.Martin-d'Hêres, Sept. 11-16, 1978. Edited by Maurice, F.; Meny, L.; Tixier, R. (1979) p. 169-211.
- 18. MATTHEWS; R.B.; DAVIS, N.C. <u>Fabrication of Th0<sub>2</sub> and Th0<sub>2</sub>- U0<sub>2</sub> pellets for proliferation resistant fuel</u>. Washington, 1979. (PNL-3210, UC-78).

¢

- 19. OOSTERKAMP, W.J. & CORREA, F. Thorium utilization in the Angra dos Reis PWR. São Paulo, Instituto de Energia Atômica,1976. (IEA-Pub. 419).
- 20. PHILIBERT, J. & TIXIER, R. Some problems with quantitative electron probe microanalysis. In: Proceedings of the Inter national Symposium held at the Ispra Joint Nuclear Research Center; On <u>electron microprobe analysis of nuclear materials</u> Italy, October 7-9, 1963. p. 13-33.
- 21. POPE, J.M. & RADFORD, K.C. Physical properties of some thoria powders and their influence on sinterability.<u>J.Nucl.Mater.</u>, 52: 241-54, 1974.
- 22. RADFORD, K.C. & BRATTON, R.J. Properties, blending and homogenization of (U.Th)02-U02 power. J. Nucl. Mater., 57: 287-302, 1975.
- 23. RANZETTA, G.V.T. & SCOTT, V.D. Microanalysis of Plutonium-Uranium Ceramic Materials. In: Proceedings of the International Symposium held at the Ispra Joint Nuclear Research

Center: On electron microprobe analysis of nuclear materials. Italy, October 7-9, 1963. p. 171-185.

- 24. RAO, S.V.K. Investigation of Th0<sub>2</sub>-U0<sub>2</sub> as nuclear fuel. <u>J.Nucl.</u> Mater., <u>12</u>: 323-9, 1964.
- REED, S.J.B. Electron\_Microprobe\_Analysises.CambridgeUniversity Press, 1975. Capitulo 11,12,13,14,15 e 16.
- 26. RENARD, A.; EVRARD, G.; VANHELLEMONT, G. Safety problems related to micro-heterogeneities in physically mixed oxide fuels. In: AMERICAN NUCLEAR SOCIETY. Fast reactor safety: meeting.on... held in Chicago, 1976. (CONF-761001).
- RENARD, A. & MOSTIN, N. Safety aspects microheterogeneities in LWR mixed oxide fuels. J. <u>Nucl. Mater.</u>, <u>§1</u>: 31-8, 1979.
- ROBERTSON, J.A.L. <u>Irradiation effects in nuclear fuels</u>. New York, N.Y., Gordon and Breach, 1969.
- 29. SANTOS, J.C. Thorium cycle possibilities in the Brazilian nuclear power. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. <u>Utilization of thorium in power reactor; report of a panel</u> on..., held in Vienna, June 1965. Vienna, 1966. p. 46-54.
- 30. SARMIENTO, S.G. & MARAJOFSKY, A. On the specification on the size of inhomogeneities in nuclear fuel pellets. In: INTER NATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Calidad en la tecnologia del combustible nuclear: seminário regional sobre...Buenos Aires, November 19-23, 1979.
- 31. STRANIK, D.A.; POWERS, H.G.; LAST, G.A. <u>Evaluation of Pu0</u><sub>2</sub> <u>homogeneity in Pu0</u><sub>2</sub>-U0<sub>2</sub> fast reactor fuel by scanning electron microprobe. Richland, 1970. (WHAN-FR-20).
- 32. THEISEN, R. & VOLLATH, D. Plutonium distribution and diffusion in UO<sub>2</sub>-PuO<sub>2</sub> ceramics. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Plutonium as a reactor fuel: proceedings of a symposium on... held in Brussels, 13-17 March, 1967. Vienna, 1967. p.253-64.
- 33. TOMASI, R. Estudo da Sinterização e formação de soluções solidas (Th,U)02. São Paulo, 1979. (Dissertação de mestrado, Ins tituto de Energia Atômica).
- 34. TREIBS, HEROLD, A. <u>Porosity Characterization of Ceramic Nuclear</u> Fuel. Practical Metallography 14 (1977) p. 583-600.
- UNDERWOOD, E.E. <u>Quantitative stereology</u>. New York, Addison-Wesley, 1970. Capitulo 2. p. 23-45.

- .65.
- 36. VERNA, R. Homogenization in power compacts of U0<sub>2</sub>-Pu0<sub>2</sub>. <u>J.</u> <u>Nucl. Mater.</u>, <u>§0</u>: 43-7, 1979.
- 37. VOLLATH, D. Methods of characterizing fuel structure. <u>J. Vurl</u> <u>Mater.</u>, <u>81</u>: 113-34, 1979.
- 38. WEISSERT, L.R. & SCHILEO, G. <u>Fabrication of therium fuct</u> <u>elements</u>. New York, N.Y., American Nuclear Society, 2065.
- 39. WINER, R.G. Thorium fuel cycle. In: UNITED STATES ATOMICENERGY COMISSION. Oak Ridge. <u>Thorium fuel cicle proceedings of a</u> <u>second international symposium on...,held in Gatlinburg,</u> <u>May: 5-6, 1966</u>. Oak Ridge ORNL, 1966.